



プラスチック中アンチモン分析用標準試料 (蛍光X線分析用)

オリジナル標準試料 新シリーズ販売のお知らせ

近年、製品中の有害物質の規制が強化されています。国際的にはIEC61249-2-21において、日本では、社団法人日本電子回路工業会(JPCA)にてハロゲンフリーの規制が行なわれており、ハロゲンと同様にプラスチックの難燃剤として使用されるアンチモンの自主規制も広がっています。電気電子機器メーカーは積極的に製品中のアンチモンフリー化を推進しています。

有害物質のスクリーニング分析には、蛍光X線分析装置が広く用いられます。蛍光X線分析は、特別な前処理が不要で、手軽かつ迅速に簡易定量を行なうことができます。しかし、アンチモン分析の際に必要な標準試料は市販されていません。

今回、このようなアンチモン分析のニーズにマッチする標準試料を新しく開発しました。

商品の特徴

- 蛍光X線分析によるプラスチック中アンチモンのスクリーニング分析が可能になります。
- 蛍光X線分析装置のメーカーを問わずお使いいただけます。
(※お使いの装置・仕様によっては、上手く測定できない可能性もあります。)
- アンチモン濃度 800ppmまでの簡易定量が可能です。



図1. プラスチック中アンチモン分析用標準試料

蛍光X線分析用標準試料

- 試料No. JSM P711-1
 - 試料形状：40mmφ、4水準/セット
 - 材質：ポリエチレン
 - 濃度レベル

試料No.	Sb (%)
JSM P711-1	a <0.001
	b 0.010
	c 0.039
	d 0.079

蛍光X線分析による測定例

使用装置：エネルギー分散型蛍光X線分析装置

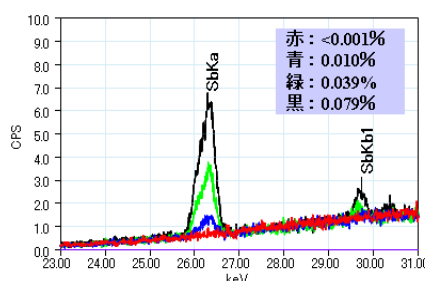


図2. 測定スペクトル

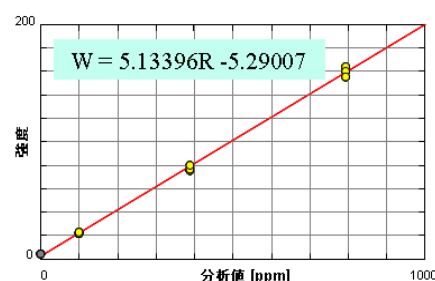


図3. 検量線

分析結果の信頼性確保

標準試料には、標準値のトレーサビリティが明確なことが要求されます。

標準値決定のための分析は、精密分析法である「酸分解-誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)」および「酸分解-原子吸光分析法(AAS)」を採用し、当社内、複数試験所にて実施しています。さらに、ERM標準物質を併行分析することでトレーサビリティを確保しています。

信頼性の高い標準試料の供給に務めています。

各種の素材や組成の標準試料を広く取り揃えています。お気軽にご相談下さい。



JFE テクノリサーチ 株式会社

<http://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2013 - 2022 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。